DIN 50451-3:2014-11 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 3: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salpetersäure mittels ICP-MS

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 4

2 Normative Verweisungen ... 4

3 Begriffe ... 4

4 Einheiten ... 4

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens ... 5
5.1 Allgemeines ... 5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung ... 5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen ... 5

6 Reagenzien ... 5

7 Geräte und Reinigung ... 5
7.1 Geräte ... 5
7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen ... 6

8 Probenahme und Probenvorbereitung ... 6
8.1 Probenahme ... 6
8.2 Vorbereitung der direkten Messung ... 6
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen ... 6

9 Herstellen der Nullwertlösungen und Blindwertprobe ... 6

10 Durchführung ... 7
10.1 Messung ... 7
10.2 Kalibrierung ... 7

11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ... 7

12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse ... 7

13 Prüfbericht ... 10

Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche ... 11

Literaturhinweise ... 19